

GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

Fairchild Semiconductor
3001 Orchard Parkway
SAN JOSE CA 95134
USA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Optokoppler
Optocoupler

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



REG.-Nr. 136616 oder/or

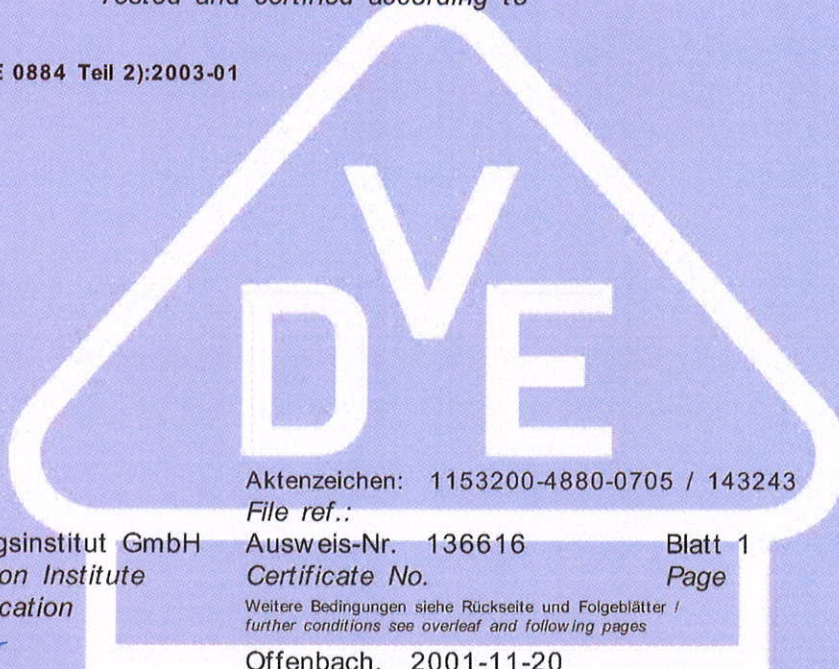


oder/or VDE-REG.-Nr. 136616

REG.-Nr. 136616

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60747-5-2 (VDE 0884 Teil 2):2003-01



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

[Signature]

Aktenzeichen: 1153200-4880-0705 / 143243

File ref.:

Ausweis-Nr. 136616

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2001-11-20

(letzte Änderung/updated 2011-01-13)

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
136616 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Fairchild Semiconductor, 3001 Orchard Parkway, SAN JOSE CA 95134, USA

Aktenzeichen / *File ref.*
1153200-4880-0705 / 143243 / FG34 / SCT

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2011-01-13 2001-11-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 136616.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 136616.
endif

Optokoppler *Optocoupler*

Typ(en) / *Type(s)*:

MOC205
MOC206
MOC207
MOC208
MOC211
MOC212
MOC213
MOC215
MOC216
MOC217
MOC223
MOC263
MOC256
MOCD207
MOCD208
MOCD211
MOCD213
MOCD217
MOCD223
FOD2712
HCPL0500
HCPL0501
HCPL0452
HCPL0453
HCPL0600
HCPL0601
HCPL0611
HCPL0700
HCPL0701
FOD2722A
FOD2722B
FOD2722C
FOD2722D
H11SADXM_5691D2
FOD 2742 A
FOD 2742 B

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
136616 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Fairchild Semiconductor, 3001 Orchard Parkway, SAN JOSE CA 95134, USA

Aktenzeichen / *File ref.*
1153200-4880-0705 / 143243 / FG34 / SCT

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2011-01-13 2001-11-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 136616.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 136616.
endif

FOD 2742 C
FOD 2712 A Option V
HCPL0630 Option V
HCPL0631 Option V
HCPL062N Option V
HCPL0637 Option V
HCPL0638 Option V
HCPL0639 Option V
HCPL0730 Option V
HCPL0731 Option V
HCPL073L Option V
HCPL0530 Option V
HCPL0531 Option V
HCPL0534 Option V
FOD053L Option V
FOD0710 Option V
FOD0720 Option V
FOD0721 Option V
FOD8001 Option V
FOD8012 Option V
FOD050L Option V
FOD060L Option V

Kriechstrecke zw. Sende- + ≥ 4 mm
Empfangsteil
*Creepage distance betw. input
+ output*

Luftstrecke zw. Sende- + ≥ 4 mm
Empfangsteil
*Clearance distance betw. input
+ output*

Isolationsspannung 565 V
(Scheitelwert) UIORM
*Insulation voltage (peak
voltage) UIORM*

Fortsetzung siehe Blatt 4 /
continued on page 4

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Fairchild Semiconductor, 3001 Orchard Parkway, SAN JOSE CA 95134, USA

Aktenzeichen / *File ref.*
1153200-4880-0705 / 143243 / FG34 / SCT

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2011-01-13 2001-11-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 136616.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 136616.
endif

Höchste zulässige Überspannung 4000 V
(Scheitel
Transient overvoltage (peak voltage))

Kriechstromfestigkeit CTI (Isolationsgruppe IIIa)
Tracking resistance CTI (insulation group IIIa)

Verschmutzungsgrad 2
Degree of pollution

Klimakategorie 55/100/21
Climatic category

Betriebstemperaturbereich - 55 °C ...+ 100 °C
Operating temperature range

Lagertemperaturbereich - 55 °C ...+ 150 °C
Storage temperature range

Sicherheitsgrenzwerte (unter Zugrundelegung der Derating Kurve)
Safety ratings (based on derating curve)

Strom ISI Eingang: 200 mA
Current ISI Input: 200 mA

Leistung PSI Ausgang: 300 mW
Power PSI Output: 300 mW

Temperatur TSI 150 °C
Temperature TSI

Klassifizierung für SMT Diese Optokoppler sind geprüft für die SMT Montage nach
Classification for SMT IEC 60068-2-58: 215°C / 40s und 260°C / 10s
These optocouplers are approved for SMT mounting acc. to IEC 60068-2-58: 215°C / 40s and 260° / 10s

Gehäusematerial außen / outside:
Case material E8436 FR-397 from Rogers Corporation
KE-96A from Kyocera

Fortsetzung siehe Blatt 5 /
continued on page 5

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
136616 5

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Fairchild Semiconductor, 3001 Orchard Parkway, SAN JOSE CA 95134, USA

Aktenzeichen / *File ref.*
1153200-4880-0705 / 143243 / FG34 / SCT

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2011-01-13 2001-11-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 136616.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 136616.
endif

Koppelmaterial HIPEC, Q3-6633 from Dow Corning
Coupling material

Anmerkung Nur VDE zugelassen mit Option V
Remark Only VDE approved with Option V

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG34
Section FG34